

## DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Tema 1 Evaluación Parcial 30 de mayo de 2022



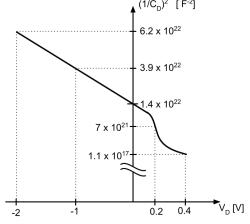
Nombre y apellido:		
Padrón: Turno:	N° de ex	2 102 022

- Es condición necesaria para aprobar el parcial que al menos el 60 % de cada ejercicio esté correctamente planteado.
- Se considerará: La claridad y síntesis conceptual de las respuestas y justificaciones, los detalles de los gráficos/circuitos, la exactitud de los resultados numéricos.
- Cada uno de los dos ejercicios debe estar resuelto en hojas independientes.

Calificación: \_\_\_\_\_

Constantes:  $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \,\mathrm{kg}; \ k = 1.38 \times 10^{-23} \,\mathrm{J/K}; \ h = 6.62 \times 10^{-34} \,\mathrm{Js}; \ q = 1.6 \times 10^{-19} \,\mathrm{C}; \ \epsilon_{r,SiO_2} = 3.9; \ \epsilon_{r,Si} = 11.7; \ \epsilon_0 = 88.5 \,\mathrm{fF/cm}.$ 

- 1) Se tiene un diodo de silicio de juntura PN simétrica del cual se conocen los siguientes parámetros:  $A = 0.1 \,\mathrm{mm^2}$ ,  $I_0 = 1 \,\mathrm{nA}$ ,  $\tau_T = 15 \,\mathrm{ns}$ ,  $V_{D(ON)} = 0.7 \,\mathrm{V}$ . Se mide la capacidad del diodo  $C_D$  a temperatura ambiente en función de la tensión aplicada y se gráfica de la forma mostrada en la figura.
  - a) ¿Que fenómenos capacitivos dan lugar a la capacidad que presenta el diodo? ¿Cuales predominan en directa y en inversa? Justificar la respuesta basándose en la física que da lugar a estos efectos.
  - b) Hallar el valor de las concentraciones de impurezas a ambos lados de la juntura y el potencial de built-in  $\phi_B$ , indicando cualquier suposición o aproximación usada. ¿Cual es el valor de la capacidad de juntura en equilibrio térmico?
  - c) Se conecta el diodo en directa a un circuito con una resistencia de  $R=2\,\mathrm{k}\Omega$  y una fuente de tensión de valor  $V_F=7\,\mathrm{V}.$  ¿En cuanto cambia la corriente del circuito cuando el valor de la fuente aumenta en  $100\,\mathrm{mV}$ ?



2) a) Tres materiales semiconductores tienen masas efectivas similares, pero distinta energía de gap. En la tabla, se resumen algunos de sus parámetros físicos a temperatura ambiente. Cada uno de los materiales es dopado con impurezas aceptoras con densidad volumétrica  $N=1\times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$ . Calcular la conductividad del material semiconductor con menor energía de gap. Justificar la respuesta indicando todas las hipótesis y aproximaciones utilizadas.

	SC 1	SC 2	SC 3
$\frac{n_i \text{ (cm}^{-3})}{\mu_n \text{ (cm}^2/\text{(Vs))}}$	$2.1 \times 10^{8}$ 850	$1.2 \times 10^{10}$ $1300$	$3.1 \times 10^{12}$ $2700$
$\mu_p \; (\mathrm{cm}^2/(\mathrm{Vs}))$	320	390	600

b) Para el circuito de la figura, donde el transistor MOSFET tiene los siguientes parámetros:  $V_T=-1\,\mathrm{V},\ k=\frac{\mu C_{ox}'}{2}\frac{W}{L}=0,35\,\mathrm{mA}\,\mathrm{V}^{-2}$  y  $\lambda\to0$ , determinar la relación entre las resistencias  $R_{G1}$  y  $R_{G2}$  para que el transistor presente una transconductancia  $g_m=0,56\,\mathrm{m}\,\mathrm{S}.$  Calcular las tensiones y corrientes de polarización del transistor. Considerar  $V_{DD}=5\,\mathrm{V}$  y  $R_D=8,6\,\mathrm{k}\Omega.$ 

